



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 17473.3—1998

2002年6月19日

2002年6月19日

## 厚膜微电子技术用贵金属浆料 测试方法 方阻测定

Test methods of precious metal pastes  
used for thick film microelectronics  
—Determination of sheet resistance

2004年5月24日



2005年05月25日



050928078256

1998-08-19 发布

1999-03-01 实施

国家质量技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
厚膜微电子技术用贵金属浆料  
测试方法 方阻测定  
GB/T 17473.3—1998

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045  
电 话:68522112

无锡富瓷快速印务有限公司印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售  
版权专有 不得翻印

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 7 千字  
1999年3月第一版 1999年3月第一次印刷  
印数 1—800

\*

书号: 155066·1-15491 定价 6.00 元

\*

标 目 366—37

## 前 言

方阻是贵金属浆料的一个重要参数,也是浆料在产品生产、科研和使用中质量控制的一个重要指标。目前我国尚未制定出浆料方阻的测试方法标准,也没有查阅到有关该测试方法的国际标准或国外先进标准。

本标准主要参照有关的技术资料,结合对浆料的方阻测量实际情况而制定的。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由中国有色金属工业总公司提出。

标准由中国有色金属工业总公司标准计量研究所归口。

本标准由昆明贵金属研究所负责起草。

本标准主要起草人:陈一、金勿毁。